任意波形発生器を用いた低歪み信号発生技術

第28回シリコンアナログRF研究会 2012.3.16

群馬大学

〇安部文隆 加藤啓介 若林和行 小林春夫(群馬大学) 小林修(STARC) 新津葵一(群馬大学)

- ・本研究の目的と今回の目標
- ・テスト信号の歪み低減技術
- シミュレーション検証
- ・実機検証
- ・まとめと今後の課題

- ・本研究の目的と今回の目標
- ・テスト信号の歪み低減技術
- シミュレーション検証
- 実機検証
- ・まとめと今後の課題

研究背景と今回の検討内容

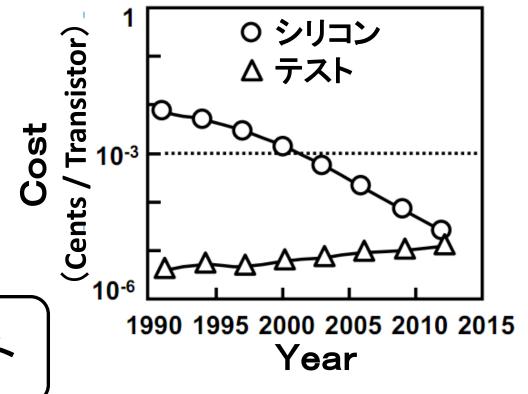
微細化の効果

シリコンコスト: 減少

テストコスト: 増加

・本研究の目的・

高品質・低コストテスト



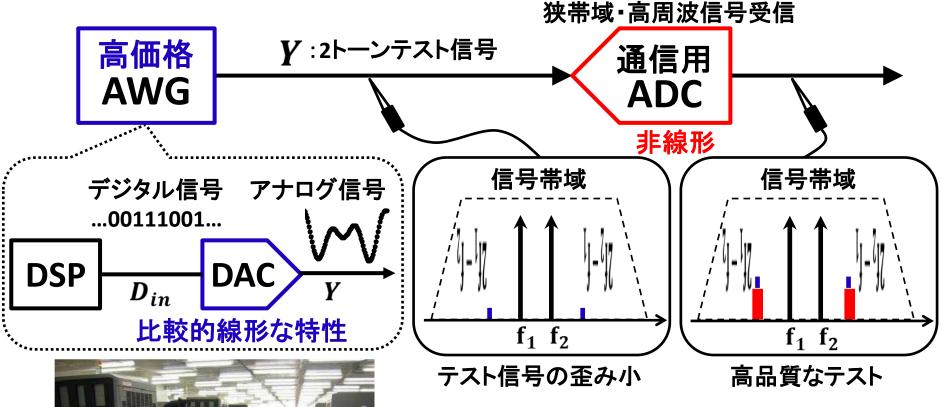
製造コストとテストコストの動向 (ITRS 2001)

検討内容

通信用ADCの線形性テスト



高価格AWGを用いた線形性テスト





〇 大量のデバイス試験装置が必要!!



より低価格なAWGに置き換え試験可能



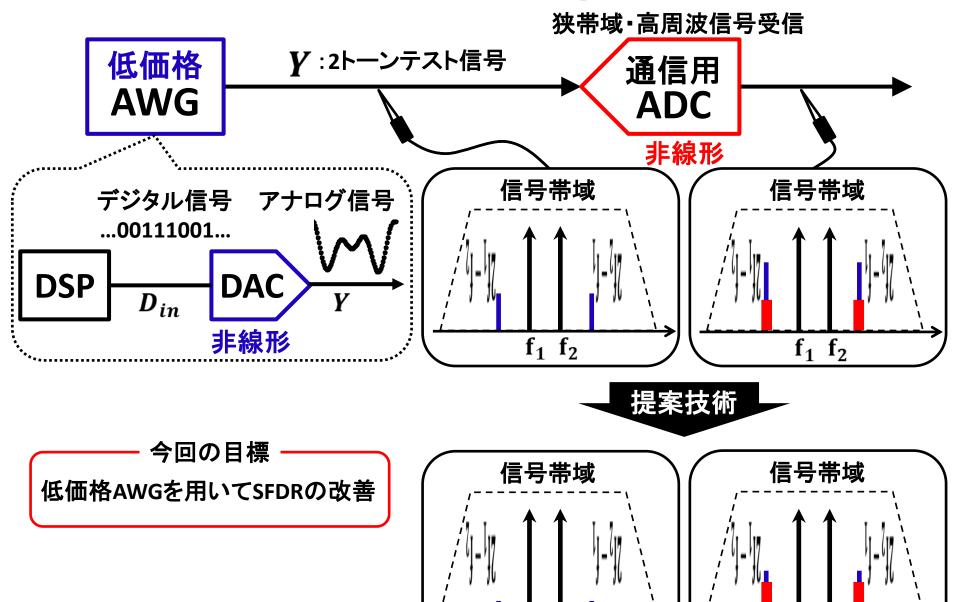
コスト低下

AWG: Arbitrary Waveform Generator

低価格AWGを用いた線形性テスト

6/25

 f_1 f_2

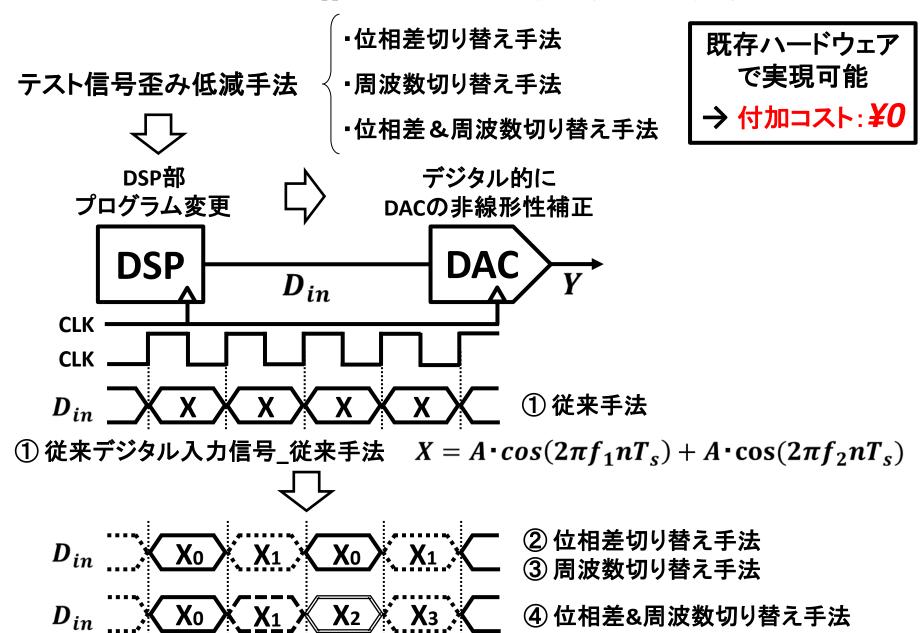


 f_1 f_2

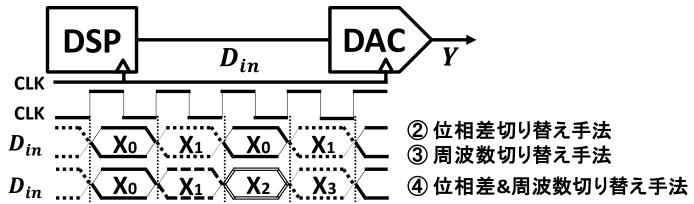
SFDR: Spurious Free Dynamic Range

- ・本研究の目的と今回の目標
- ・ <u>テスト信号の歪み低減技術</u>
- シミュレーション検証
- 実機検証
- ・まとめと今後の課題

テスト信号歪み低減手法



DAC入力インターリーブ信号



② 提案デジタル2相インターリーブ信号_位相差切り替え手法

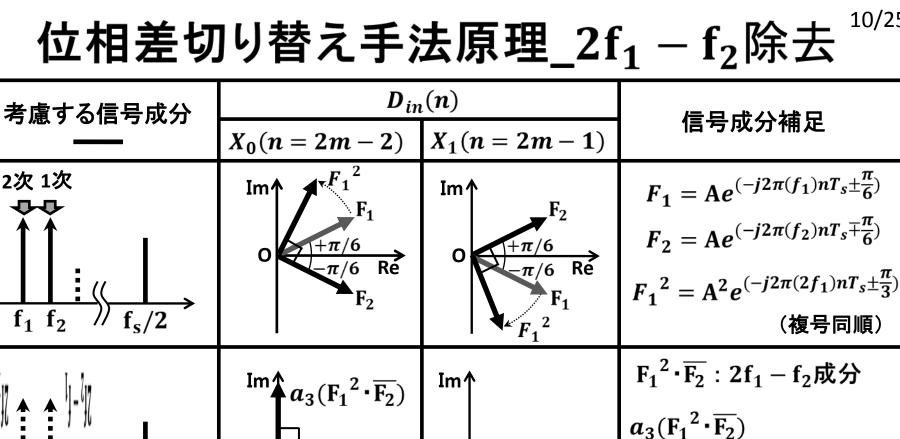
$$D_{in} \begin{cases} X_0 = A \cdot cos(2\pi f_1(2m-2)T_s + \pi/6) + A \cdot cos(2\pi f_2(2m-2)T_s - \pi/6) \\ X_1 = A \cdot cos(2\pi f_1(2m-1)T_s - \pi/6) + A \cdot cos(2\pi f_2(2m-1)T_s + \pi/6) \end{cases}$$

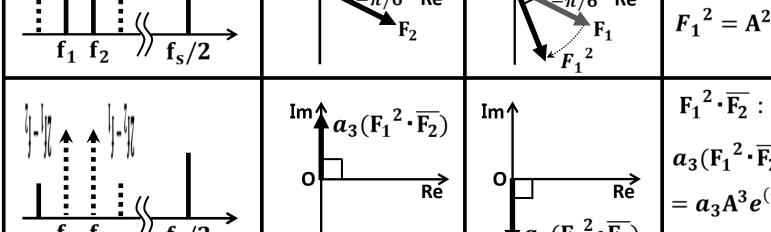
③ 提案デジタル2相インターリーブ信号_周波数切り替え手法

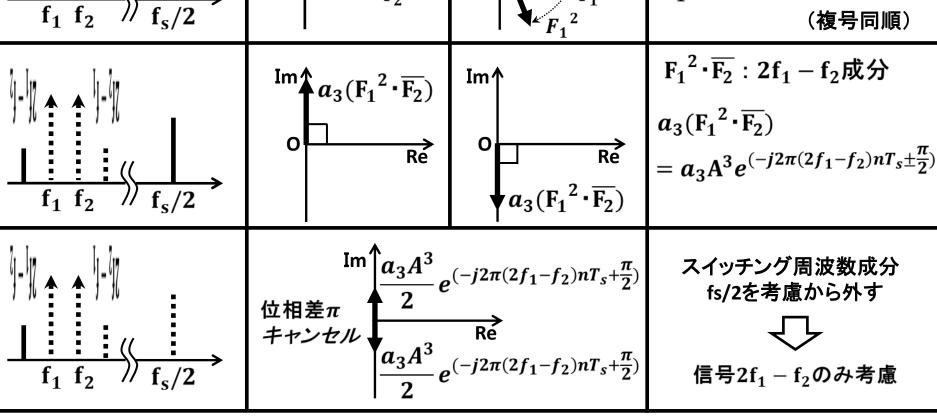
$$D_{in} \begin{cases} X_0 = 2A \cdot cos(2\pi f_1(2m-2)T_s) \\ X_1 = 2A \cdot cos(2\pi f_2(2m-1)T_s) \end{cases}$$

④ 提案デジタル4相インターリーブ信号_位相差&周波数切り替え手法

$$D_{in} \begin{cases} X_0 = 2A \cdot cos(2\pi f_1(4m - 4)T_s + \pi/6) \\ X_1 = 2A \cdot cos(2\pi f_1(4m - 3)T_s - \pi/6) \\ X_2 = 2A \cdot cos(2\pi f_2(4m - 2)T_s + \pi/6) \\ X_3 = 2A \cdot cos(2\pi f_2(4m - 1)T_s - \pi/6) \end{cases}$$



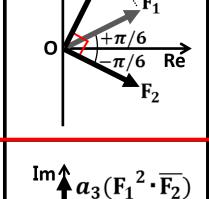


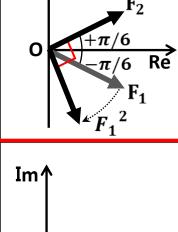


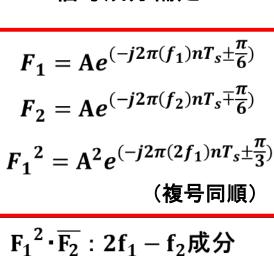
位相差切り替え手法原理_2f₁ - f₂除去

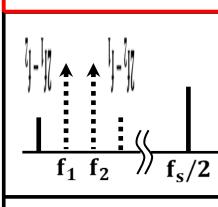
 $D_{in}(n)$ 考慮する信号成分 信号成分補足 $X_1(n=2m-1)$ $X_0(n=2m-2)$ $F_1 = \mathbf{A}e^{(-j2\pi(f_1)nT_s \pm \frac{\pi}{6})}$

2次 1次







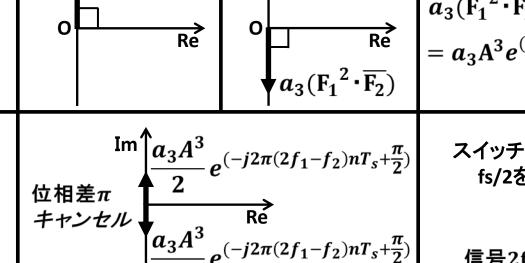




 $a_3(\overline{F_1}^2 \cdot \overline{F_2})$ = $a_3 A^3 e^{(-j2\pi(2f_1-f_2)nT_s\pm\frac{\pi}{2})}$ スイッチング周波数成分 fs/2を考慮から外す

信号2f₁ – f₂のみ考慮

$$\begin{array}{c|c}\hline f_1 & f_2 \\\hline \end{array} \begin{array}{c} f_s/2 \\\hline \end{array}$$



位相差切り替え手法原理 2f. - f。除去

考慮する信号成分	$D_{in}(n)$		<i>ᆖ</i> ᄆᅷᄼᅷᄆ
	$X_0(n=2m-2)$	$X_1(n=2m-1)$	信号成分補足
2次 1次	$\operatorname{Im} \bigwedge_{F_1}^{F_1^2}$	Im↑	$F_1 = \mathbf{A}e^{(-j2\pi(f_1)nT_s \pm \frac{\pi}{6})}$

Im⁴

 $e^{(-j2\pi(2f_1-f_2)nT_s+\frac{\pi}{2})}$

位相差π

キャンセル

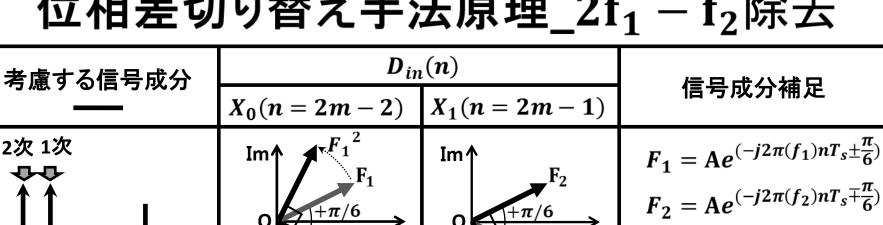
 $= a_3 A^3 e^{(-j2\pi(2f_1 - f_2)nT_s \pm \frac{\pi}{2})}$ スイッチング周波数成分 fs/2を考慮から外す 信号2f₁ – f₂のみ考慮

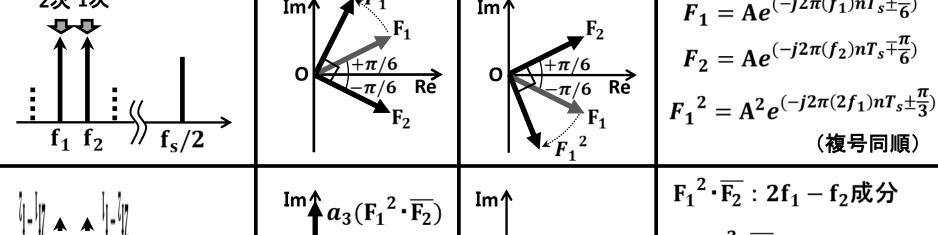
 $F_1^2 \cdot \overline{F_2} : 2f_1 - f_2$ 成分

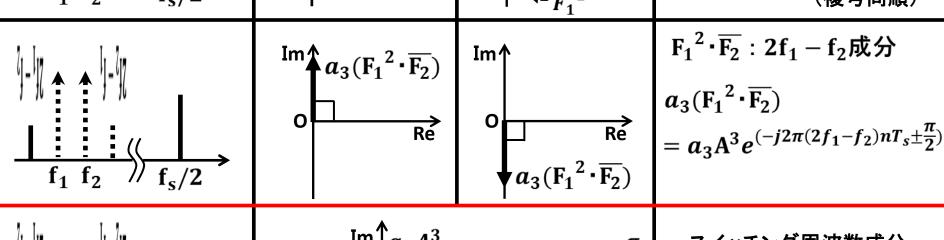
 $F_2 = Ae^{(-j2\pi(f_2)nT_s \mp \frac{\pi}{6})}$ $F_1^2 = A^2e^{(-j2\pi(2f_1)nT_s \pm \frac{\pi}{3})}$

(複号同順)

位相差切り替え手法原理_2f₁ - f₂除去

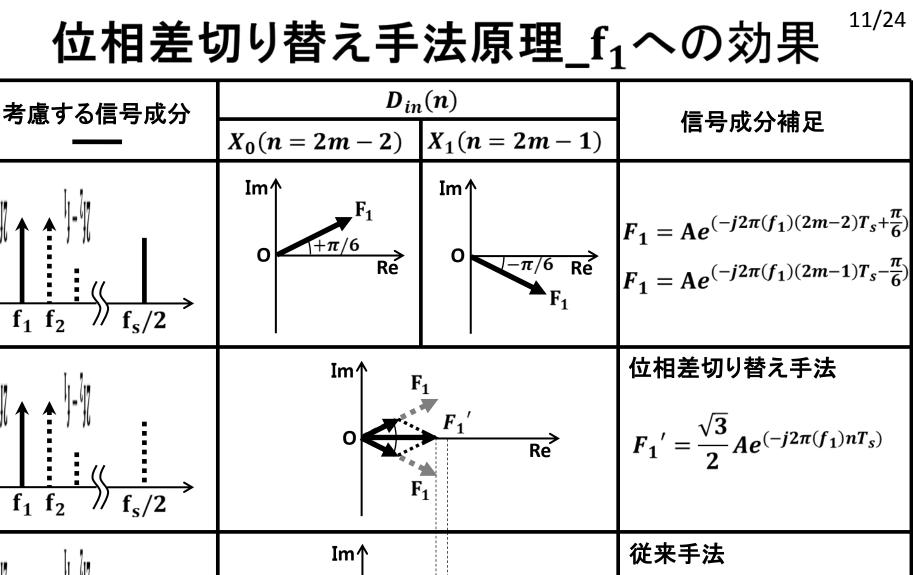


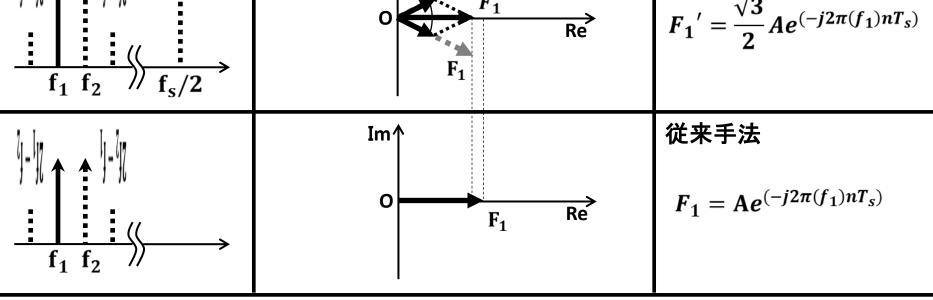


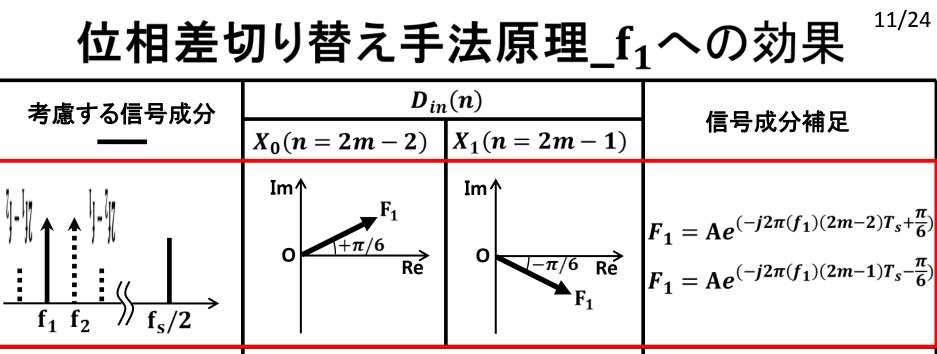


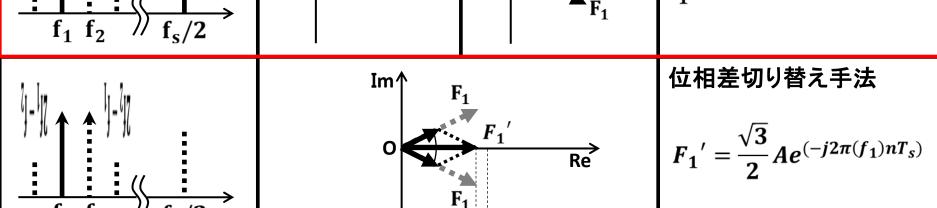
 $e^{(-j2\pi(2f_1-f_2)nT_s+\frac{\pi}{2})}$

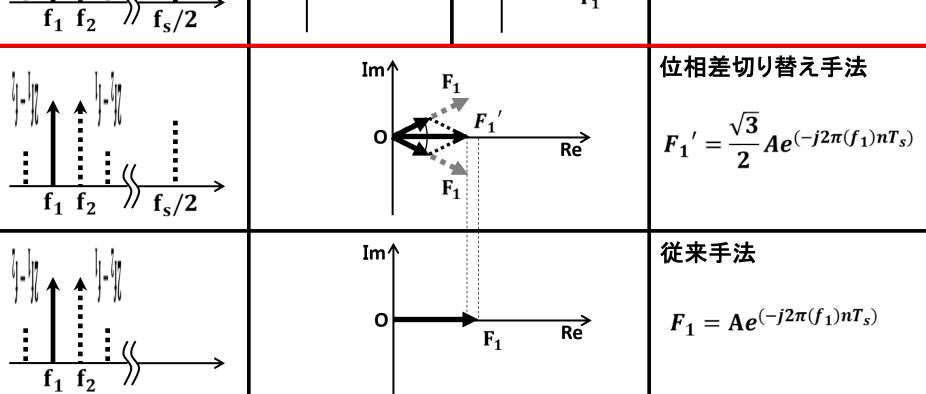
信号2f₁ – f₂のみ考慮

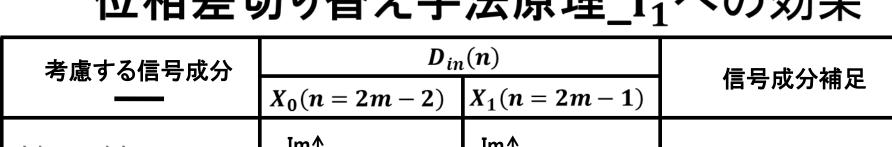


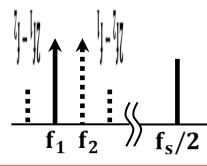


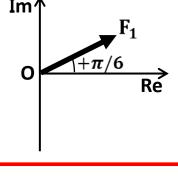


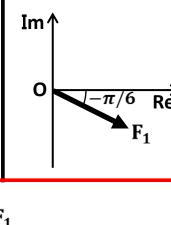


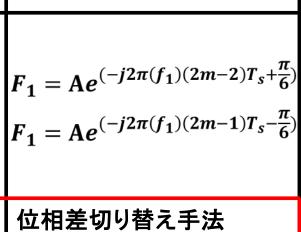




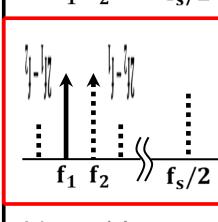


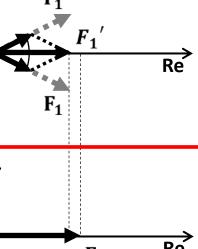


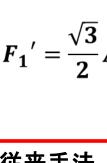


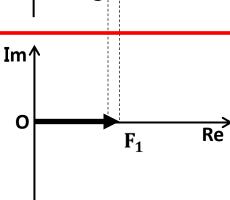


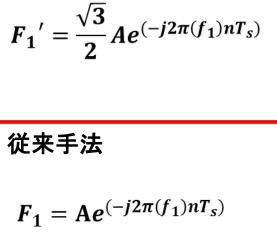
11/24

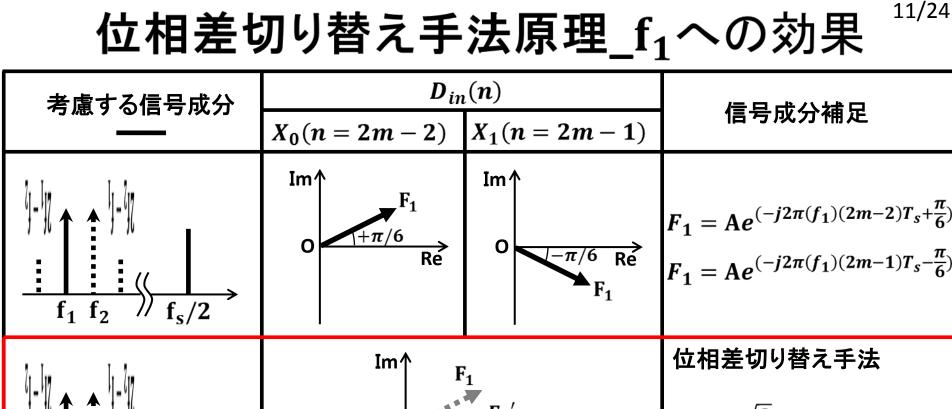


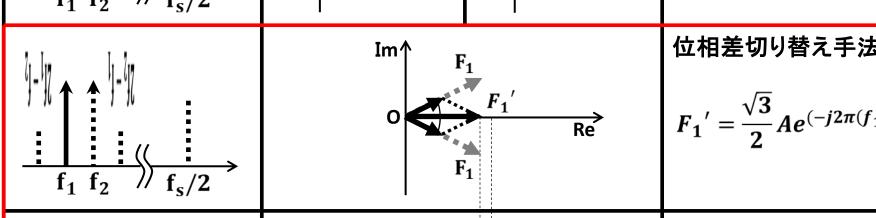




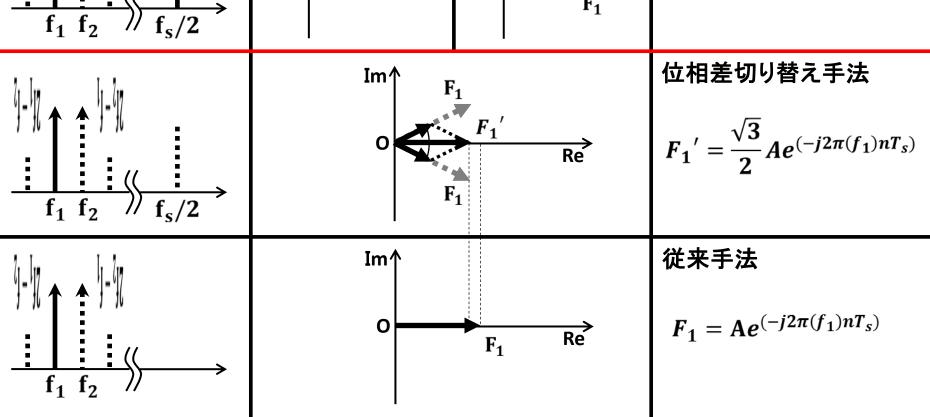




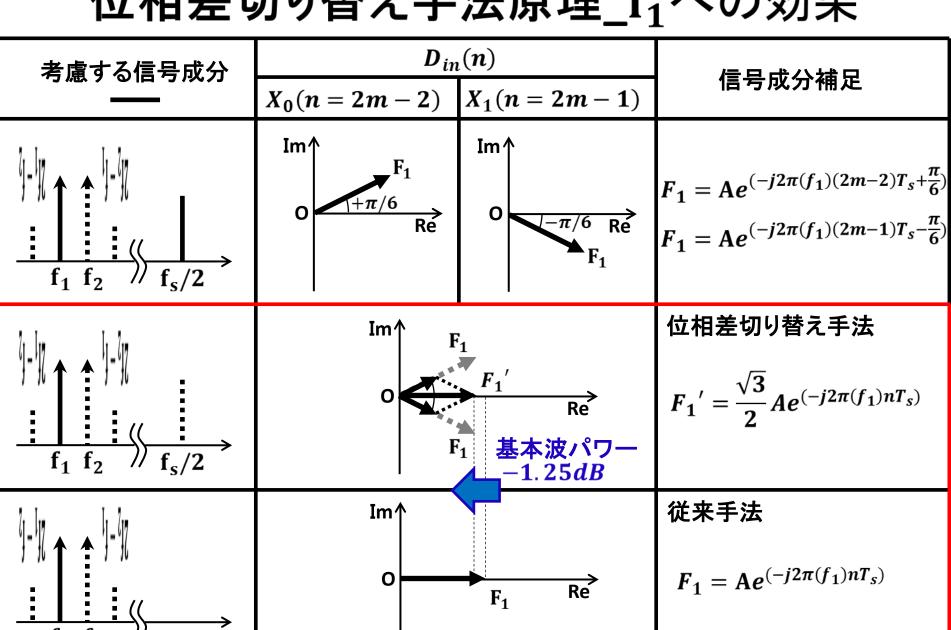




 $F_1 = Ae^{(-j2\pi(f_1)(2m-2)T_s + \frac{\pi}{6})}$ $F_1 = Ae^{(-j2\pi(f_1)(2m-1)T_s - \frac{\pi}{6})}$



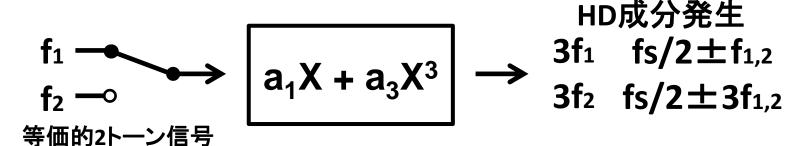
位相差切り替え手法原理_f₁への効果



周波数切り替え手法原理

 $\Re f \equiv Sin(2\pi ft)$

・ 周波数切り替え手法



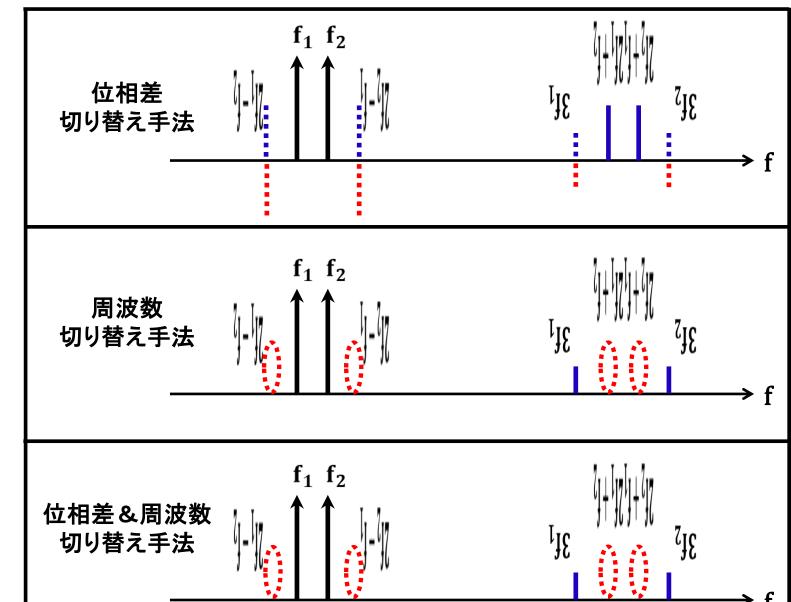
1トーンずつ3次歪みの影響を受けさせる

1トーンずつ信号を生成



相互変調歪みの発生なし高調波歪みのみ発生

提案手法の歪み除去効果



歪み信号 あり

位相差π キャンセル

歪み発生 抑制

- ・本研究の目的と今回の目標
- ・テスト信号の歪み低減技術
- ・ <u>シミュレーション検証</u>
- 実機検証
- ・まとめと今後の課題

MATLABシミュレーション

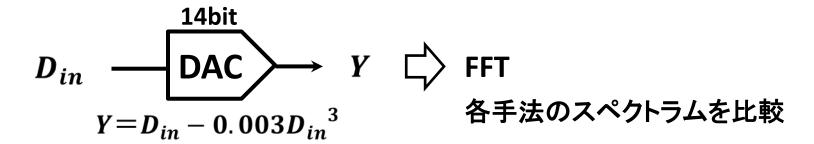
シミュレーション手法

DAC入力信号D_{in}

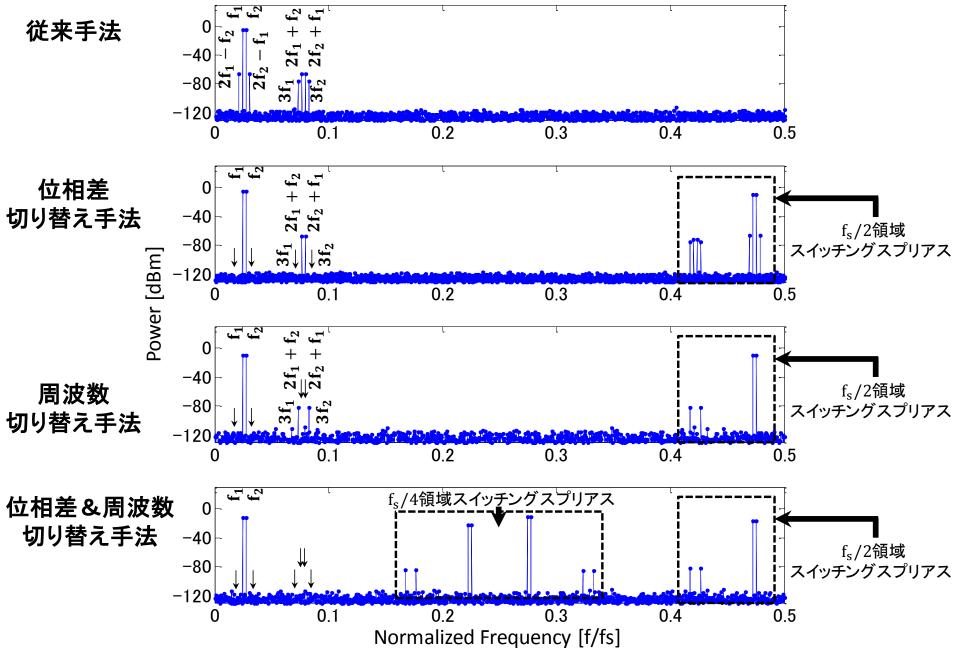
従来手法	X
位相差切り替え手法	2相インターリーブ信号 X_0 , X_1
周波数切り替え手法	2相インターリーブ信号 X_0 , X_1
位相差&周波数切り替え手法	4相インターリーブ信号 X_0 , X_1 , X_2 X_3

D_{in}パラメータ

サンプリング点数	4096
入力2ト―ン信号	$f_1 = 100$
人力2ト一ク信号	$f_2 = 153$
信号振幅 (peak-to-peak)	1.2







- ・本研究の目的と今回の目標
- ・テスト信号の歪み低減技術
- シミュレーション検証
- ・<u>実機検証</u>
- ・まとめと今後の課題

測定条件

AWG

スペクトラムアナライザ



信号



Agilent社33220A

周波数レンジ	1μHz~6MHz
振幅分解能	14bits
最大サンプリングレート	50MSa/s

ADVANTEST社R3267

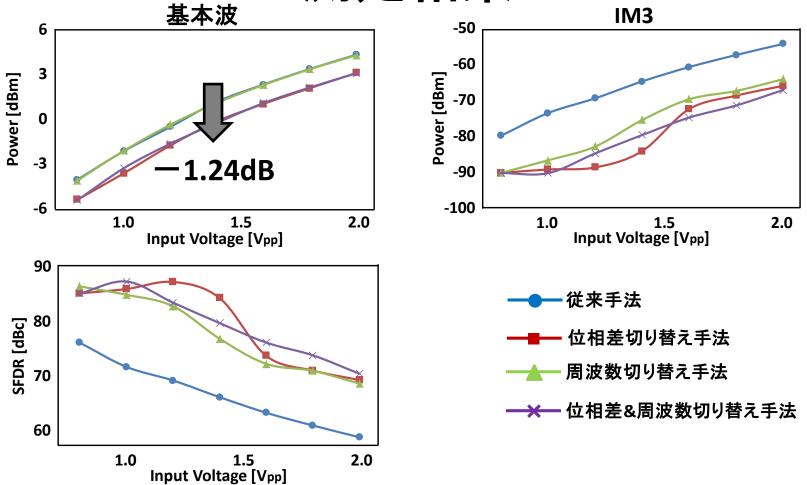
周波数帯	100Hz~8GHz
RBW	10Hz~30MHz

測定信号データ

周波数f1,f2	200kHz , 220kHz
サンプリングレート	10MSa/s
入力電圧	0.8~1.2Vpp (0.2Vstep)
オフセット	0

- •従来手法
- ・位相差切り替え手法
- ・ 周波数切り替え手法
- ・位相差&周波数切り替え手法

測定結果



位相差切り替え手法

基本波	IM3	SFDR
-1.27 dB	-13.7 dB	+12.5 dB

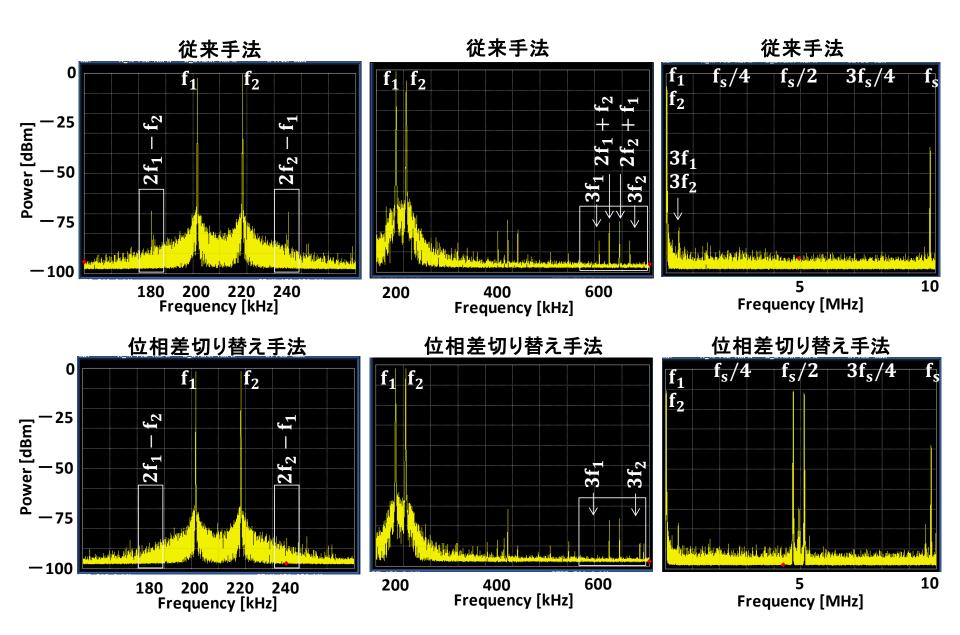
周波数切り替え手法

基本波	IM3	SFDR
0 dB	-10.7	+10.7 dB

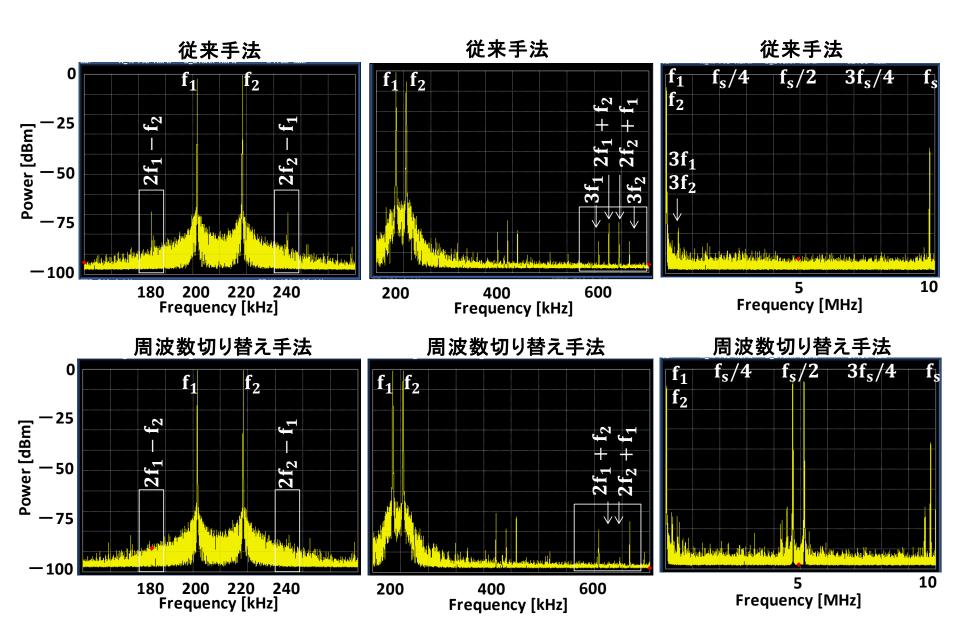
位相差&周波数切り替え手法

基本波	IM3	SFDR
-1.21	-13.6	+12.4

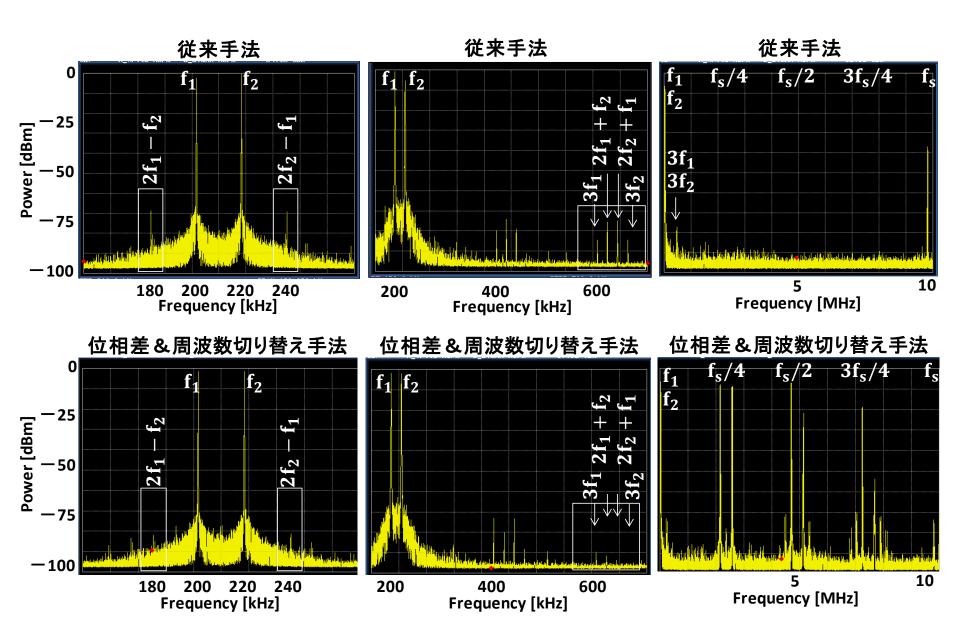
位相差切り替え手法



周波数切り替え手法

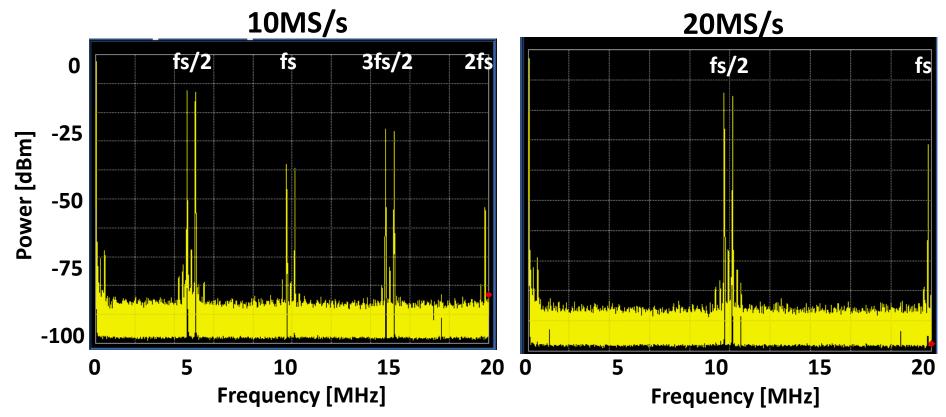


位相差&周波数切り替え手法



2倍速サンプリング

位相差切り替え手法



サンプリング速度を上げることでスプリアスが更に高周波側へ 微細化によりDAC速度の向上期待可能

→フィルタ要求の緩和へ

- ・本研究の目的と今回の目標
- ・テスト信号の歪み低減技術
- シミュレーション検証
- 実機検証
- まとめと今後の課題

まとめと今後の課題

- ・テスト信号歪み低減技術を提案
- 付加コスト ¥0 (低コスト化技術)
- ・ 位相差切り替え手法で12.5dBのSFDR改善
- ・ 周波数切り替え手法で10.4dBのSFDR改善
- ・ 位相差&周波数切り替え手法で12.4dBのSFDR 改善
- ・微細化によりDACの速度が向上することでスプリアスが更に高周波側へ移動しフィルタ要求緩和
- ・ ADCへ提案テスト信号の適用を検討